PACS numbers: 68.37.Ma, 73.43.Qt, 73.50.Jt, 75.47.-m, 75.70.Cn, 75.60.Nt, 81.40.Ef

Фазовий склад і магнеторезистивні властивості тришарових плівок Fe/Ge/Fe

О. В. Власенко, Л. В. Однодворець, І. Ю. Проценко

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

У роботі представлено результати досліджень процесів фазоутворення та магнеторезистивних властивостей термооброблених тришарових плівок Fe/Ge/Fe. Показано, що при пошаровій конденсації із наступним відпалюванням від 300 до 1070 К у системах відбувається формування ґерманідів заліза FeGe_x ($1 \le x < 2$) із феромагнетними властивостями по усьому об'єму зразка, що призводить до зростання величини магнетоопору. Встановлено, що максимальні значення магнетоопору у 0,35–0,44% спостерігаються при загальній концентрації атомів Ge від 60 до 68% ат.

В работе представлены результаты исследований процессов фазообразования и магниторезистивных свойств термообработанных трёхслойных плёнок Fe/Ge/Fe. Показано, что при послойной конденсации с последующим отжигом от 300 до 1070 К в системах происходит формирование германидов железа FeGe_x ($1 \le x < 2$) с ферромагнитными свойствами по всему объёму образца, что приводит к росту величины магнетосопротивления. Установлено, что максимальные значения магнетосопротивления 0,35-0,44% наблюдаются при общей концентрации атомов Ge от 60 до 68% ат.

The results of studies of phase-formation processes and magnetoresistive properties of annealed three-layer Fe/Ge/Fe films are presented. As shown, at the layering condensation followed by annealing from 300 to 1070 K, in the systems, there is the formation of iron germanides FeGe_x ($1 \le x < 2$) with ferromagnetic properties throughout the sample bulk that leads to an increase of magnetoresistance. As revealed, the maximum values of the magnetoresistance, 0.35-0.44%, are observed at the total concentration of Ge atoms from 60 to 68% at.

Ключові слова: фазоутворення, магнетоопір, ґерманіди заліза, тришарові плівки.

(Отримано 20 вересня 2013 р.; остаточн. варіант — 11 грудня 2013 р.)

1637

1. ВСТУП

Розвиток сенсорної та спінової електроніки стимулює пошук нових багатошарових функціональних матеріалів типу феромагнетний метал/напівпровідник, в яких, на відміну від магнетних напівпровідникових структур, сформованих шляхом введення магнетних домішок у напівпровідник, можлива реалізація механізму спінзалежного розсіювання електронів [1], утворення гранульованих твердих розчинів та бінарних фаз [2]. Поглиблене вивчення властивостей систем метал/напівпровідник пов'язане з вирішенням питання їх практичного застосування як середовищ для магнетного запису інформації з підвищеною щільністю, високочутливих елементів багатофункціональних сенсорів [3], нових типів діодних і транзисторних структур [4] та стимулюється необхідністю розв'язання окремих проблем фізики твердого тіла [5, 6].

Вивченню властивостей плівкових матеріалів метал/напівпровідник присвячена значна кількість робіт. Так, наприклад, авторами роботи [7] на основі результатів досліджень структури, магнетних і транспортних властивостей та Голлового ефекту в мультишарах Fe/Ge, отриманих методом магнетронного розпилення, показано, що структура таких зразків являє собою періодичне чергування шарів полікристалічного Fe і аморфного Ge. Встановлено [7], що температурний коефіцієнт опору має додатне значення при кімнатній температурі та від'ємне — при низьких температурах, а значення Голлового коефіцієнта при товщині фрагмента мультишару 5,2 нм на три порядки більше, ніж в масивному Fe.

Оскільки кристалічні решітки Ge i GaAs мають кубічну гранецентровану структуру типу алмазу і близькі параметри (0,5658 і 0,5653 нм відповідно), то це уможливлює формування епітаксійних шарів з малою густиною дислокацій. У зв'язку з цим доцільно вивчати властивості плівкових систем у вигляді метал/GaAs/Ge або метал/Ge, оскільки рухливість носіїв заряду в шарах Ge більша, ніж в GaAs, що уможливлює формування гетероструктур для польових транзисторів, фотодетекторів і датчиків температури [8].

Авторами роботи [9] проведено дослідження процесів фазоутворення в плівкових системах $Ge/Fe/SiO_2$ методом рентгенівської дифракції в інтервалі температур 100–600 К із товщиною окремих шарів від 28 до 215 нм. Встановлено, що в залежності від температури термообробки і концентрації атомів заліза в плівкових системах можуть утворюватись рівноважні фази: Fe₃Ge, Fe₅Ge₃, Fe₄Ge₃, Fe₆Ge₅, FeGe i FeGe₂.

У роботах [10, 11] показано, що ґерманіди заліза FeGe і FeGe₂, плівки яких широко застосовуються в інтегрованих мікроелектронних пристроях, утворюються в широкому інтервалі температур та характеризуються близькою до ідеальної стехіометрією і практично відсутністю області гомогенності.

Вивченню кристалічної структури і фазового складу, температурних і польових залежностей питомого опору плівок Fe_xGe_{1-x} , отриманих методом магнетронного розпилення, в інтервалі температур 2–300 К присвячена робота [12], авторами якої встановлено, що властивості плівкових систем суттєво залежать від концентрації Fe, що пов'язано із зміною механізмів розсіювання електронів при варіюванні концентрації магнетної компоненти.

Нами був застосований експериментальний підхід, запропонований в роботі [13], авторами якої проведені дослідження температурної залежності питомої провідності плівкових сплавів рідкоземельний метал (Sc, Y)/феромагнетний метал (Fe, Co, Ni)/напівпровідник (Ge). Досліджено властивості не системи взагалі, а конкретної фази, прогнозовано сформованої за певних експериментальних умов.

Усе зазначене вище обумовило актуальність даної роботи, мета якої полягала у дослідженні магнеторезистивних властивостей фази ґерманіду заліза FeGe, який утворюється при загальній концентрації атомів Ge від 60 до 70% в тришарових плівкових системах Fe/Ge/Fe, отриманих методом пошарової конденсації з наступним відпалюванням протягом трьох циклів «нагрівання ↔ охолодження» в температурному інтервалі 300–1070 К.

2. МЕТОДИКА ТА ТЕХНІКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Формування тришарових зразків Fe/Ge/Fe проводилось в робочій камері вакуумної установки ВУП-5М (вакуум ~10⁻³-10⁻⁴Па) методом термічного випаровування з пошаровою конденсацією Fe і Ge на ситалові підкладки (П) через маску з геометричними розмірами 1×10 мм. За допомогою цифрових мультиметрів типу UT70D і UT70B та хромель-алюмелевої термопари контролювалися електричний опір плівок (точність ±0,05%) та температура відпалювання (точність ±1 К). Магнеторезистивні властивості досліджувались в автоматизованому режимі [14] за температури 300 К з використанням чотириточкової схеми у трьох геометріях вимірювання магнетоопору (МО): поздовжній, поперечній та перпендикулярній (рис. 1). Постійне магнетне поле створювалося електромагнетами із максимальною величиною магнетної індукції B = 450 мТл.

Для розрахунку величини МО використовувалося співвідношення:

$$MO = [R(B) - R(450)]/R(450) = \Delta R/R(450),$$

де R(B) — опір плівкового зразка в зовнішньому магнетному полі, $R_{\min} = R(450)$ — опір при B = 450 мТл.

Дослідження кристалічної структури і фазового складу плівкових зразків проводилися методами просвічуючої електронної мік-



Рис. 1. Геометрії вимірювання МО: *а* — поздовжня (∥), *б* — поперечна (+), *в* — перпендикулярна (⊥) геометрії.

роскопії та електронографії (мікроскоп ПЕМ-125К). Дифракційні картини розшифровувалися за стандартною методикою, яка детально описана в роботі [15].

Загальна концентрація атомів окремих компонент розраховувалася за формулою

$$c_i = rac{D_i d_i \mu_i^{-1}}{D_{
m Fe} d_{
m Fe} \mu_{
m Fe}^{-1} + D_{
m Ge} d_{
m Ge} \mu_{
m Ge}^{-1}},$$

де $i = 1, 2, a D i \mu$ — густина і молярна маса Fe або Ge.

Товщина окремих шарів контролювалась методом кварцового резонатора, що забезпечувало високу точність вимірювання (±1 нм).

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Дослідження фазового складу плівкових систем $Fe(10)/Ge(x)/Fe(15)/\Pi$, $Fe(10)/Ge(x)/Fe(20)/\Pi$ і $Fe(5)/Ge(x)/Fe(5)/\Pi$ при x = 2-40 нм у невідпаленому і відпаленому стані вказують на його залежність від температури відпалювання та загальної концентрації атомів Fe і Ge. Товщина окремих шарів була вибрана таким чином, щоб розглянути варіанти різного співвідношення загальної концентрації атомів окремих компонент, а саме $c_{Fe} < c_{Ge}$, $c_{Fe} \ge c_{Ge}$.

Дослідження фазового стану і мікроструктури одношарових плівок Ge як компонент тришарових систем Fe/Ge/Fe вказують на те, що плівки Ge при відносно низьких температурах мають аморфну структуру і при певній температурі кристалізуються. Так, наприклад, плівка Ge(20)/П за температур відпалу до $T_{\rm B} = 520$ К знаходиться в аморфному стані (рис. 2, *a*); при менших товщинах область стабілізації аморфної фази зміщується в бік більших температур. При $T_{\rm B} = 570$ К плівка Ge(20)/П кристалізується, але знаходиться в дуже дисперсному стані (середній розмір кристалітів $L_{\rm cp} \cong 10-15$ нм); при температурі $T_{\rm B} = 620$ К плівка має полікристалічну струк-



Рис. 2. Електронограми та відповідні їм мікроструктури одношарових плівок Ge(20)/П (в дужках — товщина плівки в нм) при $T_{\rm B} = 470$ (*a*) та 620 K (б).

туру (рис. 2, б) із $L_{cp} \cong 25$ нм. На електронограмах від одношарових плівок Ge фіксуються сліди діоксиду ґерманію GeO₂ у вигляді дуже слабких ліній (102) і (203), у той же час при відпалюванні плівки Fe(5)/Ge(25)/Fe(5)/П до $T_{\rm B} = 1070$ К (рис. 3, б) ці лінії на електронограмах відсутні, що говорить про розпад GeO₂.

На електронограмах від тришарових систем на основі плівок Fe і Ge, відпалених до температури $T_{\rm B} = 870$ K, у випадку $c_{\rm Fe} < c_{\rm Ge}$ (рис. 3, *a*) фіксуються лінії твердого розчину атомів Fe в Ge (т.р. (Ge, Fe)) із слідами GeO₂ (із лініями вказаними вище), такі плівки мають дрібнодисперсну структуру ($L_{\rm cp} \cong 25-30$ нм). У тришарових системах, відпалених до 1070 K, на основі т.р. (Ge, Fe) формуються ґерманіди заліза FeGe_x, де $1 \le x < 2$ (рис. 3, δ). Сформований у результаті відпалювання ґерманід заліза FeGe_x проявляє антиферомагнетні властивості до 298–398 K [16, 17]. На електронограмі також фіксується дуже слабка лінія від фази FeGe₂. Таким чином, при відпалюванні тришарових систем Fe/Ge/Fe/П при $c_{\rm Fe} < c_{\rm Ge}$ утворюється т.р. (Ge, Fe), на основі якого формуються ґерманіди заліза FeGe_x із $L_{\rm cp} \cong 45-$ 70 нм, магнеторезистивні властивості яких і було досліджено в даній роботі.

Особливості структури ґерманіду заліза FeGe були вивчені в роботах [17, 18]. Авторами роботи [17] встановлено, що фаза FeGe може мати ОЦК або гексагональну кристалічні решітки. Фаза FeGe з кубічною структурою [17] може утворюватись при температурах $T_{\rm B} < 900$ К (параметр решітки a = 0,4698 нм). Примітивна комірка гексагональної решітки, що складає третю частину від повної гексагональної комірки і містить 6 атомів, половина з яких атоми Ge, показана на рис. 4, б. Атоми Ge розташовані у вершинах ромбів у верхній та нижній площинах комірки, а також в центрах тяжіння двох правильних трикутників, які складають ромб, що знаходиться на поло-

вині висоти комірки. Атоми Fe розташовуються тільки на верхній та нижній площинах комірки на середині сторін та в центрах ромбів.



Рис. 3. Електронограми, відповідні їм мікроструктури та польові залежності МО в перпендикулярній геометрії вимірювання для невідпаленої (a, s) і відпаленої до 1070 К (δ, z) тришарової системи Fe(5)/Ge(25)/Fe(5)/П.



Рис. 4. Фрагмент фазової діаграми для системи Fe–Ge [16] (*a*) і елементарна комірка гексагональної решітки фази FeGe_x ($x \cong 1$) [17] (δ).

Структура комірки нагадує шарувату структуру, в якій шари з перевагою атомів Fe чергуються із шарами з атомів Ge. У «змішаних» шарах відстань між атомами Fe і Ge точно така ж, як і між атомами Fe, та дорівнює d = 0,250 нм [18].

Результати досліджень магнеторезистивних властивостей плівок Fe/Ge/Fe показують (див. таблицю), що максимальні значення MO = 0,28-0,40% спостерігаються при кімнатній температурі у відпалених до 1070 К системах з товщиною немагнетного шару $d_{Ge} = 25-40$ нм ($c_{Fe} < c_{Ge}$). Зростання величини МО пояснюється утворенням при таких умовах (концентрації і температурі) ґерманідів заліза FeGe_x в усьому об'ємі зразка.

Як приклад, на рис. З наведено польові залежності МО для тришарових плівок Для залежності МО від концентрації c_{Ge} в трьох геометріях вимірювання є характерним збільшення значення МО з ростом загальної концентрації атомів Ge в системі. Особливо це помітно (див. рис. 3, *s*, *c* і таблицю) у перпендикулярній геометрії, в якій при концентрації $c_{\text{Ge}} = 60-68\%$ ат. величина МО становить 0,35–0,44%. Зміщення максимумів на польовій залежності магнетоопору пов'язане із формуванням у тришарових системах при $T_{\text{в}} =$ = 1070 К доменної структури магнетних фаз ґерманідів заліза FeGe_x та, як результат цього, появою магнеторезистивного гістерезису.

Система (товщина, нм)	с _{Ge} , % ат.	$T_{_{\rm B}} = 300 \ {\rm K}$				$T_{\rm B} = 1070 \ {\rm K}$			
		MO, %			Фазовий	MO, %			Фазовий
		=	+	\bot	склад		+	\bot	склад
$c_{ m Fe}$ > $c_{ m Ge}$									
Fe(10)/Ge(2)/Fe(20)/II	3	0,280	0,035	0,058		-	-	-	
Fe(10)/Ge(4)/Fe(15)/II	8	0,082	0,037	0,029	ОЦК-Fe+ +a-Ge+ +т.р.(Ge,Fe)	0,030	0,030	0,020	ОЦК-Fe+ +т.р.(Ge,Fe)
Fe(10)/Ge(6)/Fe(20)/II	9	0,088	0,034	0,020		_	_	_	
Fe(10)/Ge(6)/Fe(15)/II	11	0,086	0,045	0,032		0,030	0,012	0,010	
Fe(10)/Ge(8)/Fe(20)/II	12	0,085	0,036	0,042		0,033	0,015	0,010	
Fe(10)/Ge(10)/Fe(20)/II	15	0,083	0,027	0,049		0,035	0,023	0,025	
$m{c}_{ m Fe} {\cong} m{c}_{ m Ge}$									
Fe(5)/Ge(20)/Fe(5)/П	52	0,015	0,025	0,011	ОЦК-Fe+ +a-Ge+ +т.р.(Ge,Fe)	_	_	_	ОЦК-Fe+ +к-Ge+ +т.р.(Ge,Fe)
$c_{ m Fe} < c_{ m Ge}$									
Fe(5)/Ge(25)/Fe(5)/II	60	0,021	0,040	0,019	ОЦК-Fe+	0,35	0,28	0,40	к-Ge+
Fe(5)/Ge(40)/Fe(5)/Π	68	0,034	0,042	0,032	+к-Ge+ +т.р.(Ge,Fe)	0,44	0,32	0,44	+ гек. $FeGe_x$

ТАБЛИЦЯ. Фазовий склад і магнеторезистивні властивості тришарових плівок Fe/Ge/Fe.

4. ВИСНОВКИ

Дослідження фазового складу та магнеторезистивних властивостей тришарових систем Fe/Ge/Fe вказують на те, що при пошаровій конденсації із наступним відпалюванням від 300 до 1070 К в системах у випадку $c_{\rm Fe} < c_{\rm Ge} = 60-68\%$ ат. відбувається формування магнетних фаз ґерманідів заліза FeGe_x в усьому об'ємі зразка та їх феромагнетне упорядкування, що призводить до зростання величини MO від (0,02–0,04)% у невідпалених системах до (0,35–0,44)% у відпалених до 1070 К зразках.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- 1. M. F. Toney, J. A. Borchers, K. V. O'Donovan, C. F. Majkrzak, D. T. Margulies, and E. E. Fullerton, *Phys. Lett.*, **86**: 162506 (2005).
- 2. I. S. Golovin, T. V. Ibleva, S. Jager, P. Jencus, H. Neuhauser, S. A. T. Redfern, and C. Siemers, *Solid State Phenom.*, **137**: 59 (2008).
- 3. D. Sellmyer and R. Skomski, *Advanced Magnetic Nanostructures* (Berlin: Springer: 2006).
- N. A. Morley, M. R. J. Gibbs, K. Fronc, and R. Zuberek, J. Magn. Magn. Mater., 286: 91 (2005).
- В. Е. Буравцова, Е. А. Ганьшина, В. С. Гущин, С. И. Касаткин, А. М. Муравьева, Н. В. Плотникова, Ф. А. Пудонин, Физика твердого тела, 46, No. 5: 864 (2003).
- 6. С. І. Проценко, Л. В. Однодворець, А. М. Чорноус, Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів в умовах фазоутворення (Суми: СумДУ: 2011).
- 7. Y. W. Liu, W. B. Mi, E. Y. Jiang, and H. L. Bai, J. Appl. Phys., 102: 063712 (2007).
- 8. V. K. Lazarov, L. Lari, P. M. Lytvyn, V. V. Kholevchuk, and V. F. Mitin, *J. Phys.: Conf. Series*, **371**: 012040 (2012).
- O. M. Ndwandwe, C. C. Theron, T. K. Marais, and R. Pretorius, *J. Mater. Res.*, 18, No. 8: 1900 (2003).
- 10. A. Dayyer and P. Feschotte, J. Less-Common Met., 72, No. 1: 51 (1980).
- 11. С. В. Вонсовский, Магнетизм (Москва: Наука: 1971).
- 12. W. B. Mi, Y. W. Liu, E. Y. Jiang, and H. L. Baia, J. Appl. Phys., 103: 093713 (2008)
- Б. П. Яцишин, Д. М. Фреїк, Ю. К. Гореленко, О. Г. Миколайчук, Г. С. Байцар, Фізика і хімія твердого тіла, 8, № 2: 305 (2007).
- 14. M. G. Demydenko, S. I. Protsenko, D. M. Kostyuk, and I. V. Cheshko, J. Nano-Electron. Phys., 3, No. 4: 106 (2011).
- 15. І. Ю. Проценко, А. М. Чорноус, С. І. Проценко, *Прилади і методи* дослідження плівкових матеріалів (Суми : СумДУ: 2007).
- Н. П. Лякишев, О. А. Банных, Л. Л. Рохлин, Диаграммы состояния двойных металлических систем (Москва: Машиностроение: 1997), т. 2.
- 17. И. Н. Шабанова, В. И. Кормилец, Л. Д. Загребин, Н. С. Теребова, Журн. структур. химии, **39**, № 6: 1098 (1998).
- А. З. Меньшиков, Ю. А. Дорофеев, А. Е. Теплых, Физика твердого тела, 41, вып. 2: 283 (1999).